Statistique des dislocations en solution solide





Quantitative prediction of solute strengthening in aluminium alloys

Gerard Paul M. Leyson¹, William A. Curtin¹*, Louis G. Hector Jr² and Christopher F. Woodward³

$$\tau_{y0} = \frac{\pi}{2} \frac{\Delta E_b}{b\zeta_c(w_c)w_c} = 1.01 \left(\frac{c^2 \Delta \tilde{E}_p{}^4(w_c)}{\Gamma b^5 w_c{}^5}\right)^{\frac{1}{3}}$$

Table 2 | Predicted and experimental^{14,15} tensile yield stresses at T = 0 K and T = 78 K for various Al-X alloys. Solute concentrations are from refs 14,15. Quantities in parenthesis include contribution from Fe solutes, with Fe concentrations shown, as discussed in the text.

Solute	c (%)	c _{Fe} (×10 ⁻⁴ %)	Tensile vield stress a. (MPa)		
			Predicted (OK)	Predicted (78K)	Experiment (78)
Mg	0.444	•	34.2	20.7	20.6
Mg	0.810	-	51.1	33.4	34.2
Cr	0.073	10	21.1	12.1 (19.5)	23.7
Cr	0.302	12	54.5	37.6 (43.2)	50.2
Cu	0.090	12	12.0	5.3 (16.2)	12.3
Cu	1.650	50	83.5	59.5 (76.9)	86.6
Mg-Si	0.365/0.823	Unknown	40.6	25.5	36.3



Solid solution hardening in Ni(Al) and Al(Mg)

Atomistic model: Embeded atom method (Murray S. Daw and M. I. Baskes PRB 1984)

Ni-Ni Angelo *et al.*: *Modell. Simul. Mater. Sci. Eng. 3*, 289 (1995). Al-Al Voter and Chen: *Mater. Res. Soc. Symp. Proc.* 82, 175 (1987). Ni-Al Rodary *et al.*: *Phys. Rev. B* 70, 054111 (2004).

Mg-Mg X.-Y. Liu, P. P. Ohotnicky, J. B. Adams, C. L. Rohrer, and J. R. W. Hyland, Surf. Sci. 373, 357 (1996). Al-Mg X.-Y. Liu, J. B. Adams, F. Ercolessi, and J. Moriarty, Modelling Simul. Mater. Sci. Eng. 4, 293 (1996)

Simulation avec un seul obstacle



Jmol



Hypothèse: γ_{I} et d varient peu avec c

 Γ_{A}

 $\Gamma_{Al} = 0.158 \text{ nN}$

 $\Gamma_{Ni} = 0.324 \text{ nN}$

1



$$\Gamma = \mu b^2 \frac{1 - 2\nu}{4\pi (1 - \nu)} \ln(L_z/2b),$$

 $\Gamma_{Al} = 0.18 \text{ nN}$
 $\Gamma_{Ni} = 0.47 \text{ nN}$

5

SRMP



dislocation-obstacle interaction potential





SRMP



• obstacles in plane contiguous to the glide plane



SRMP











G. P. Purja Pun and Y. Mishin, Philos. Mag. 89, 3245 2009. Ni(Al)

Al(Mg) M.I. Mendelev *et al.*, Philos. Mag. **89**, 3269 (2009).



- ASS allows to capture the dislocation core details
 - The 1D elastic line model allows scale transitions + good understanding
- **Q** Projects:
 - study solid solution hardening in bcc (ELM model development)
 - effect of temperature in the elastic line model (solute atom diffusion)





CEA-SRMP/Stress (MPa) = 150 Temperature (K) = 0





Depinning of edge dislocations

Modèle de tension de ligne pour une approche multi-echelle de la formation des paires de décrochement

> Auteurs : D. Rodney^a et L. Proville^b a) b) CEA, DMN Service de Recherches de Métallurgie Physique



Prédictions du modèle de tension de ligne comparées au résultats de simulation atomistique



Conclusions

- Dislocations cut nanophases under a radius r_c, above Orowan loops are formed at low temperature
- L The loop formation is different for screw and edge
- For cutting mechanism, the critical stress varies as r^2
- For Orowan mechanism, the log prefactor is $\mu b(2-\nu)/8(1-\nu)$ for edge dislocations
- Projects:
 - effect of solid solution
 - effect of temperature (climb)



II. Ni₃Al nanophase strengthening for Ni based alloys



-х́



Orowan looping – Theory





Ancrage d'une dislocation vis dans une solution solide modèle CFC

Thèse de S. Patinet

Etude à l'échelle atomique avec potentiels inter-atomique EAM

Calcul du seuil de décrochage statique



I. Peierls mechanism

Collaboration: D. Rodney INP Grenoble, Science et Ingénierie Matériaux Procédés

 \rightarrow In bcc thermal activation of dislocation glide proceeds through kink pair nucleation on screw

- → Interatomic forces model = Embedded Atom method
- → Not yet efficient at modeling screw dislocation in bcc metals
- → Lomer dislocation in Al-Al F Freelessi and J. Adams, Europhys. Lett.









Enthalpie d'activation d'une paire de décrochement sur La dislocation vis modèle de Mendelev (Phil. Mag. 2003) pour Fe cc

W

900 [6]





L. Proville, Annals of Physics, accepted for publication http://lanl.arxiv.org/abs/0904.3357.

L. Proville, J. Stat. Phys. 137, 717 (2009)

Conclusion:

• le modèle de ligne élastique peut être développé afin d'intégrer la complexité du niveau atomique.

• possibilité de paramétrer % calcul AB-initio **→** éviter artefact des potentiels EAM

• transition d'échelle vers DDD envisageable

